



IEC 60384-1

Edition 5.0 2016-02

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Fixed capacitors for use in electronic equipment –  
Part 1: Generic specification**

**Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –  
Partie 1: Spécification générique**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 31.060

ISBN 978-2-8322-3153-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	9
INTRODUCTION.....	11
1 General .....	13
1.1 Scope .....	13
1.2 Normative references .....	13
2 Technical data.....	15
2.1 Symbols, units and abbreviated terms .....	15
2.1.1 General .....	15
2.1.2 Letter symbols .....	15
2.1.3 Abbreviations.....	16
2.2 Terms and definitions .....	16
2.3 Preferred values and additional technical requirements .....	21
2.3.1 General .....	21
2.3.2 Preferred values of nominal capacitance .....	21
2.3.3 Preferred values of rated voltage .....	21
2.3.4 Rated a.c. load .....	21
2.3.5 Rated pulse load.....	22
2.3.6 Temperature derated voltage.....	22
2.4 Marking.....	23
2.4.1 General .....	23
2.4.2 Coding.....	23
3 Quality assessment procedures .....	23
4 Tests and measurement procedures.....	24
4.1 General.....	25
4.2 Standard atmospheric conditions .....	25
4.2.1 Standard atmospheric conditions for testing.....	25
4.2.2 Recovery conditions.....	25
4.2.3 Referee conditions .....	26
4.2.4 Reference conditions .....	26
4.3 Drying.....	26
4.4 Visual examination and check of dimensions .....	26
4.4.1 Visual examination .....	26
4.4.2 Dimensions (gauging) .....	26
4.4.3 Dimensions (detail) .....	26
4.5 Insulation resistance .....	27
4.5.1 Preconditioning .....	27
4.5.2 Measuring conditions .....	27
4.5.3 Test points .....	27
4.5.4 Test methods .....	27
4.5.5 Temperature compensation .....	28
4.5.6 Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	28
4.6 Voltage proof .....	29
4.6.1 General .....	29
4.6.2 Test circuit (for the test between terminations).....	29
4.6.3 Test.....	30
4.6.4 Requirements .....	32

4.6.5	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	32
4.7	Capacitance .....	32
4.7.1	Measuring frequency and measuring voltage .....	32
4.7.2	Measuring equipment .....	33
4.7.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	33
4.8	Tangent of loss angle and equivalent series resistance (ESR) .....	33
4.8.1	Tangent of loss angle .....	33
4.8.2	Equivalent series resistance (ESR) .....	33
4.9	Leakage current .....	34
4.9.1	Preconditioning .....	34
4.9.2	Test method .....	34
4.9.3	Power source .....	34
4.9.4	Measuring accuracy .....	34
4.9.5	Test circuit .....	34
4.9.6	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	34
4.10	Impedance .....	34
4.11	Self-resonant frequency and inductance .....	35
4.11.1	Self-resonant frequency ( $f_r$ ) .....	35
4.11.2	Inductance .....	38
4.11.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	38
4.12	Outer foil termination .....	38
4.13	Robustness of terminations .....	39
4.13.1	General .....	39
4.13.2	Test $U_{a1}$ – Tensile .....	39
4.13.3	Test $U_b$ – Bending (half of the sample) .....	40
4.13.4	Test $U_c$ – Torsion (remaining sample) .....	40
4.13.5	Test $U_d$ – Torque .....	40
4.13.6	Visual examination .....	40
4.14	Resistance to soldering heat .....	41
4.14.1	Preconditioning and initial measurement .....	41
4.14.2	Test procedure .....	41
4.14.3	Recovery .....	41
4.14.4	Final inspection, measurement and requirements .....	41
4.15	Solderability .....	41
4.15.1	General .....	41
4.15.2	Preconditioning .....	41
4.15.3	Test procedure .....	42
4.15.4	Final inspection, measurements and requirements .....	42
4.16	Rapid change of temperature .....	42
4.16.1	Initial measurement .....	42
4.16.2	Test procedure .....	42
4.16.3	Final inspection, measurements and requirements .....	42
4.17	Vibration .....	42
4.17.1	Initial measurement .....	42
4.17.2	Test procedure .....	43
4.17.3	Electrical test (intermediate measurement) .....	43
4.17.4	Final inspection, measurements and requirements .....	43
4.18	Bump (repetitive shock) .....	43
4.18.1	Initial measurement .....	43

4.18.2	Test procedure.....	43
4.18.3	Final inspection, measurements and requirements.....	43
4.19	Shock .....	43
4.19.1	Initial measurement.....	43
4.19.2	Test procedure.....	43
4.19.3	Final inspection, measurements and requirements.....	44
4.20	Container sealing .....	44
4.21	Climatic sequence.....	44
4.21.1	General .....	44
4.21.2	Initial measurements .....	44
4.21.3	Dry heat.....	44
4.21.4	Damp heat, cyclic, Test Db, first cycle .....	44
4.21.5	Cold.....	44
4.21.6	Low air pressure .....	45
4.21.7	Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles .....	45
4.21.8	Final measurements.....	45
4.22	Damp heat, steady state.....	45
4.22.1	Initial measurement.....	45
4.22.2	Test procedure.....	45
4.22.3	Final inspection, measurements and requirements.....	46
4.23	Endurance .....	46
4.23.1	Initial measurements .....	46
4.23.2	Test procedure.....	46
4.23.3	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	46
4.23.4	Test voltage.....	46
4.23.5	Placement in the test chamber .....	47
4.23.6	Recovery .....	47
4.23.7	Final inspection, measurements and requirements.....	47
4.24	Variation of capacitance with temperature.....	48
4.24.1	Static method.....	48
4.24.2	Dynamic method .....	48
4.24.3	Methods of calculation .....	49
4.25	Storage.....	50
4.25.1	Storage at high temperature .....	50
4.25.2	Storage at low temperature .....	50
4.26	Surge.....	51
4.26.1	Initial measurement.....	51
4.26.2	Test procedure.....	51
4.26.3	Final inspection, measurements and requirements .....	52
4.26.4	Information to be given in the relevant detail specification.....	52
4.27	Charge and discharge tests and inrush current test.....	52
4.27.1	Initial measurement.....	52
4.27.2	Test procedure.....	52
4.27.3	Charge and discharge .....	53
4.27.4	Inrush current .....	54
4.27.5	Final inspection, measurements and requirements .....	54
4.28	Pressure relief (for aluminium electrolytic capacitors).....	54
4.28.1	General .....	54
4.28.2	AC test .....	54

4.28.3	DC test .....	54
4.28.4	Pneumatic test.....	54
4.28.5	Final inspection, measurements and requirements .....	54
4.29	Characteristics at high and low temperature.....	54
4.29.1	Test procedure.....	54
4.29.2	Requirements .....	55
4.30	Thermal stability test.....	55
4.31	Component solvent resistance.....	55
4.31.1	Initial measurements .....	55
4.31.2	Test procedure.....	55
4.31.3	Final inspection, measurements and requirements .....	55
4.32	Solvent resistance of marking.....	55
4.32.1	Test procedure.....	55
4.32.2	Final inspection, measurements and requirements .....	56
4.33	Mounting (for surface mount capacitors only).....	56
4.33.1	Substrate .....	56
4.33.2	Wave soldering .....	56
4.33.3	Reflow soldering .....	56
4.34	Shear test .....	59
4.34.1	Test procedure.....	59
4.34.2	Final inspection, measurements and requirements .....	59
4.35	Substrate bending test .....	59
4.35.1	Test procedure.....	59
4.35.2	Recovery .....	60
4.35.3	Final inspection and requirements .....	60
4.36	Dielectric absorption .....	60
4.36.1	Test procedure.....	60
4.36.2	Requirement .....	61
4.37	Damp heat, steady state, accelerated .....	61
4.37.1	Initial measurements .....	61
4.37.2	Test methods .....	61
4.37.3	Test procedures .....	61
4.37.4	Final inspection, measurements and requirements .....	61
4.38	Passive flammability.....	61
4.38.1	Test procedure.....	61
4.38.2	Final inspection, measurements and requirements .....	62
4.39	High surge current test.....	62
4.39.1	Initial measurements .....	62
4.39.2	Test procedure.....	62
4.39.3	Requirements for the charging circuit .....	63
4.39.4	Nonconforming items .....	63
4.40	Voltage transient overload (for aluminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte).....	63
4.40.1	Initial measurement.....	63
4.40.2	Test procedure.....	63
4.40.3	Final inspection, measurements and requirements .....	65
4.40.4	Conditions to be prescribed in the relevant specification .....	65
4.41	Whisker growth test.....	65
4.41.1	General .....	65

4.41.2	Preparation of specimen.....	66
4.41.3	Initial measurement.....	66
4.41.4	Test procedures .....	66
4.41.5	Test severities .....	66
4.41.6	Final inspection, measurements and requirements .....	66
Annex A (informative)	Interpretation of sampling plans and procedures as described in IEC 60410 for use within quality assessment systems.....	67
Annex B (informative)	Rules for the preparation of detail specifications for capacitors and resistors for electronic equipment for use within quality assessment systems .....	68
B.1	Drafting.....	68
B.2	Reference standard.....	68
B.3	Circulation .....	68
Annex C (informative)	Layout of the first page of a PCP/CQC specification .....	69
Annex D (informative)	Requirements for capability approval test report .....	70
D.1	General.....	70
D.2	Requirements.....	70
D.3	Summary of test information (for each CQC).....	70
D.4	Measurement record .....	70
Annex E (informative)	Guide for pulse testing of capacitors.....	71
E.1	Overview.....	71
E.2	Typical capacitor pulse conditions .....	71
E.3	Effect of inductance on pulse testing .....	72
Annex F (informative)	Guidance for the extension of endurance tests on fixed capacitors.....	74
F.1	Overview.....	74
F.2	Guidelines.....	74
Annex G (normative)	Damp heat, steady state with voltage applied, for metallized film capacitors only .....	75
G.1	Overview.....	75
G.2	Test procedure.....	75
Annex H (normative)	Accelerated damp heat, steady state, for multilayer ceramic capacitors only .....	76
H.1	Mounting of capacitors .....	76
H.2	Initial measurement.....	76
H.3	Test procedure.....	76
H.4	Recovery .....	76
H.5	Final inspection, measurements and requirements .....	76
Annex Q (informative)	Quality assessment procedures .....	77
Q.1	General.....	77
Q.1.1	Scope of this annex .....	77
Q.1.2	Quality assessment definitions .....	78
Q.1.3	Rework .....	78
Q.1.4	Alternative test methods .....	79
Q.1.5	Certified test records of released lots .....	79
Q.1.6	Unchecked parameters .....	79
Q.1.7	Delayed delivery .....	79
Q.1.8	Repair .....	79
Q.1.9	Registration of approvals.....	80
Q.1.10	Manufacture outside the geographical limits .....	80

Q.2 Qualification approval (QA) procedures .....	80
Q.2.1 Eligibility for qualification approval.....	80
Q.2.2 Application for qualification approval .....	80
Q.2.3 Subcontracting.....	80
Q.2.4 Test procedure for the initial product qualification approval .....	80
Q.2.5 Granting of qualification approval .....	80
Q.2.6 Maintenance of qualification approval.....	81
Q.2.7 Quality conformance inspection.....	81
Q.3 Capability approval (CA) procedures.....	81
Q.3.1 General .....	81
Q.3.2 Eligibility for capability approval .....	81
Q.3.3 Application for capability approval .....	82
Q.3.4 Subcontracting.....	82
Q.3.5 Description of the capability .....	82
Q.3.6 Demonstration and verification of capability .....	82
Q.3.7 Granting of capability approval .....	82
Q.3.8 Maintenance of capability approval.....	82
Q.3.9 Quality conformance inspection.....	82
Q.4 Technology approval (TA) procedure .....	83
Q.4.1 General .....	83
Q.4.2 Eligibility for technology approval .....	83
Q.4.3 Application of technology approval .....	83
Q.4.4 Subcontracting.....	83
Q.4.5 Description of technology .....	83
Q.4.6 Demonstration and verification of the technology .....	83
Q.4.7 Granting of technology approval .....	84
Q.4.8 Maintenance of technology approval.....	84
Q.4.9 Quality conformance inspection.....	84
Bibliography .....	85
 Figure 1 – Reactive power against frequency .....	22
Figure 2 – Relation between category temperature range and applied voltage.....	23
Figure 3 – Voltage-proof test circuit.....	30
Figure 4 – Schematic diagram of the impedance measuring circuit.....	35
Figure 5 – Capacitor mounting arrangement .....	36
Figure 6 – Capacitor mounting arrangement .....	37
Figure 7 – Typical diagram of an absorption oscillator-wavemeter .....	37
Figure 8 – Schematic diagram of the measuring circuit .....	38
Figure 9 – Test circuit .....	39
Figure 10 – Test circuit for electrolytic capacitors .....	47
Figure 11 – Relay circuit .....	51
Figure 12 – Thyristor circuit .....	51
Figure 13 – Voltage waveform across capacitor .....	52
Figure 14 – Voltage and current waveform .....	53
Figure 15 – Suitable substrate for mechanical tests .....	58
Figure 16 – Suitable substrate for electrical tests.....	59

Figure 17 – High surge current test .....	63
Figure 18 – Voltage transient overload test circuit .....	64
Figure 19 – Voltage waveform .....	65
Table 1 – Referee conditions .....	26
Table 2 – Measurement of insulation resistance .....	27
Table 3 – Measuring points .....	29
Table 4 – Tensile force .....	40
Table 5 – Torque .....	40
Table 6 – Number of cycles .....	45
Table 7 – Severities and requirements .....	62

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –****Part 1: Generic specification****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60384-1 has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment

This fifth edition cancels and replaces the fourth edition published in 2008 and constitutes a technical revision, including minor revisions related to tables, figures and references.

This edition contains the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- INTRODUCTION added;
- 4.41 Whisker growth test added;
- Annex Q completely restructured.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/2420/FDIS	40/2444/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

A list of all the parts of the IEC 60384 series, under the general title *Fixed capacitors for use in electronic equipment*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## INTRODUCTION

The specification system for fixed capacitors for use in electronic equipment is structured in a hierarchical system consisting of the following specification types.

### **Generic specification**

The generic specification covers all subjects mainly common to the family of fixed capacitors for use in electronic equipment, such as terminology, methods of measurement and tests. Where the individual subjects require the prescription conditions or parameters specific to the particular subfamily or type of fixed capacitor, such prescriptions are required to be given by one of the subordinate specifications.

For the scope of fixed capacitors, the numeric reference to the generic specification is IEC 60384-1.

### **Sectional specification**

Sectional specifications cover all subjects additional to those given in the generic specification, which are specific to a defined sub-group of fixed capacitors. These subjects normally are preferred values for dimensions and characteristics, additional test methods and relevant prescriptions for test methods given in the generic specification, prescriptions for sampling and for the preparation of specimen, recommended test severities and preferred acceptance criteria. The sectional specification also outlines the structure and scope of the test schedules which are to be applied in all subordinate detail specifications.

For the scope of fixed capacitors, the numeric references to the sectional specifications reach from IEC 60384-2 for polyester film capacitors to currently IEC 60384-26 for aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte. The variety of sectional specifications may be adapted to the portfolio of different technologies of fixed capacitors.

### **Detail specification**

Detail specifications give directly, or by making reference to other specifications, all information necessary to completely describe a given type and range of fixed capacitors, including prescriptions of all values for dimensions and characteristics. They also give all information required for the quality assessment of the covered type and range of fixed capacitors within a suitable quality assessment system, including prescriptions for all applied test severities and acceptance criteria, and the completed test schedules.

Detail specifications can be either specifications within the IEC system, another specification system linked to IEC, or specified by the manufacturer or user. For the scope of fixed capacitors, the numeric references to detail specifications are for example IEC 60384-3-101, if related to the sectional specification IEC 60384-3 and to the ancillary blank detail specification IEC 60384-3-1.

### **Blank detail specification**

The hierarchical system of specifications is supplemented by one or more blank detail specifications to a sectional specification, which are used to ensure a uniform presentation of detail specifications. The blank detail specifications provide the specification writer with a template on the layout to be adopted and on the information to be given and with guidance for the preparation of detail specifications in line with the requirements of the superior generic or sectional specifications. Blank detail specifications are not considered as relevant specifications since they do not themselves describe any particular component.

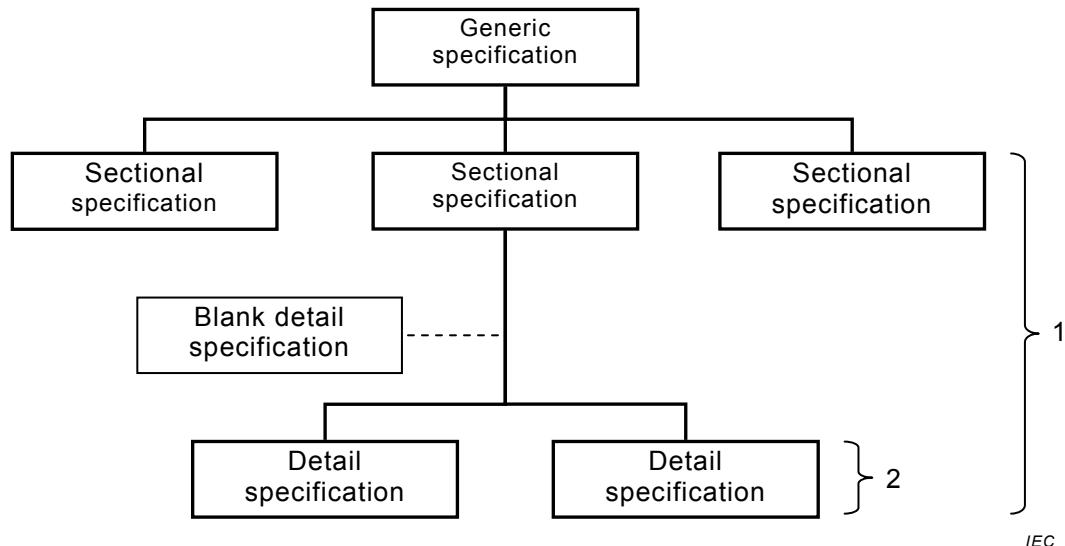
The presence of an established hierarchical specification system with blank detail specifications permits the preparation of detail specifications even outside of the relevant IEC technical committee.

For the scope of fixed capacitors, the numeric references to blank detail specifications are, for example, IEC 60384-3-1, if related to the sectional specification IEC 60384-3.

### Relevant specification

In this system the term “relevant specification” addresses subordinate specifications containing specific requirements, where applicable.

Any generic or sectional specification may use abstract and universal references to subordinate specifications of either hierarchical level by use of the expression “relevant specification”.



### Key

- 1 Indicates the range of “*Relevant specifications*” to the superior generic specification, where applicable.
- 2 Indicates the range of “*Relevant specifications*” to the superior sectional specification, where applicable.

## FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –

### Part 1: Generic specification

## 1 General

### 1.1 Scope

This part of IEC 60384 is a generic specification and is applicable to fixed capacitors for use in electronic equipment.

It establishes standard terms, inspection procedures and methods of test for use in sectional and detail specifications of electronic components for quality assessment or any other purpose.

### 1.2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary*<sup>1</sup>

IEC 60062, *Marking codes for resistors and capacitors*

IEC 60063, *Preferred number series for resistors and capacitors*

IEC 60068-1:2013, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-1:2007, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold*

IEC 60068-2-2:2007, *Environmental testing – Part 2-2: Tests – Tests B: Dry heat*

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-13:1983, *Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test M: Low air pressure*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-17:1994, *Environmental testing – Part 2-17: Tests – Test Q: Sealing*

IEC 60068-2-20:2008, *Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads*

IEC 60068-2-21:2006, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

---

<sup>1</sup> [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

IEC 60068-2-27:2008, *Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-30:2005, *Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)*

IEC 60068-2-45:1980, *Environmental testing – Part 2-45: Tests – Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents*  
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-54:2006, *Environmental testing – Part 2-54: Tests – Test Ta: Solderability testing of electronic components by the wetting balance method*

IEC 60068-2-58:2015, *Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)*

IEC 60068-2-67:1995, *Environmental testing – Part 2-67: Tests – Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components*

IEC 60068-2-69:2007, *Environmental testing – Part 2-69: Tests – Test Te: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method*

IEC 60068-2-78:2012, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60068-2-82:2007, *Environmental testing – Part 2-82: Tests – Test XW1: Whisker test methods for electronic and electric components*

IEC 60294, *Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations*

IEC 60617, *Graphical symbols for diagrams*

IEC 60695-11-5:2004, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60717, *Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations*

IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages*

IEC 61249-2-7:2002, *Materials for printed boards and other interconnecting structures – Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad – Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad*

ISO 3, *Preferred numbers – Series of preferred numbers*

ISO 80000-1, *Quantities and units – Part 1: General*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	93
INTRODUCTION .....	95
1 Généralités .....	97
1.1 Domaine d'application .....	97
1.2 Références normatives .....	97
2 Données techniques .....	99
2.1 Symboles, unités et abréviations .....	99
2.1.1 Généralités .....	99
2.1.2 Symboles littéraux .....	99
2.1.3 Abréviations .....	100
2.2 Termes et définitions .....	100
2.3 Valeurs préférentielles et exigences techniques supplémentaires .....	105
2.3.1 Généralités .....	105
2.3.2 Valeurs préférentielles de la capacité nominale .....	105
2.3.3 Valeurs préférentielles de la tension assignée .....	105
2.3.4 Charge assignée en alternatif .....	105
2.3.5 Charge assignée en impulsions .....	106
2.3.6 Tension corrigée en fonction de la température .....	106
2.4 Marquage .....	107
2.4.1 Généralités .....	107
2.4.2 Codage .....	107
3 Procédures d'assurance de la qualité .....	107
4 Essais et procédures de mesure .....	108
4.1 Généralités .....	109
4.2 Conditions atmosphériques normalisées .....	109
4.2.1 Conditions atmosphériques normalisées d'essai .....	109
4.2.2 Conditions de reprise .....	109
4.2.3 Conditions d'arbitrage .....	110
4.2.4 Conditions de référence .....	110
4.3 Séchage .....	110
4.4 Examen visuel et contrôle des dimensions .....	110
4.4.1 Examen visuel .....	110
4.4.2 Dimensions (calibrage) .....	110
4.4.3 Dimensions (détail) .....	111
4.5 Résistance d'isolement .....	111
4.5.1 Préconditionnement .....	111
4.5.2 Conditions de mesure .....	111
4.5.3 Points d'essai .....	111
4.5.4 Méthodes d'essai .....	112
4.5.5 Compensation de température .....	112
4.5.6 Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	112
4.6 Tension de tenue .....	114
4.6.1 Généralités .....	114
4.6.2 Circuit d'essai (pour l'essai entre sorties) .....	114
4.6.3 Essai .....	115
4.6.4 Exigences .....	116

4.6.5	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	116
4.7	Capacité .....	117
4.7.1	Fréquence de mesure et tension de mesure .....	117
4.7.2	Équipement de mesure .....	117
4.7.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	117
4.8	Tangente de l'angle de perte et résistance-série équivalente (RSE) .....	117
4.8.1	Tangente de l'angle de perte .....	117
4.8.2	Résistance-série équivalente (RSE) .....	118
4.9	Courant de fuite .....	118
4.9.1	Préconditionnement .....	118
4.9.2	Méthode d'essai.....	118
4.9.3	Source d'alimentation.....	118
4.9.4	Exactitude de mesure.....	118
4.9.5	Circuit d'essai .....	118
4.9.6	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	119
4.10	Impédance .....	119
4.11	Inductance et fréquence de résonance propre.....	120
4.11.1	Fréquence de résonance propre ( $f_r$ ) .....	120
4.11.2	Inductance .....	123
4.11.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	123
4.12	Sortie de l'armature extérieure.....	123
4.13	Robustesse des sorties .....	124
4.13.1	Généralités .....	124
4.13.2	Essai Ua <sub>1</sub> – Traction.....	124
4.13.3	Essai Ub – Pliage (sur la moitié de l'échantillon).....	125
4.13.4	Essai Uc – Torsion (autre moitié de l'échantillon).....	125
4.13.5	Essai Ud – Couple .....	125
4.13.6	Examen visuel .....	125
4.14	Résistance à la chaleur de brasage .....	125
4.14.1	Préconditionnement et mesurage initial .....	125
4.14.2	Procédure d'essai .....	125
4.14.3	Reprise .....	126
4.14.4	Inspection finale, mesurage et exigences .....	126
4.15	Brasabilité.....	126
4.15.1	Généralités .....	126
4.15.2	Préconditionnement .....	126
4.15.3	Procédure d'essai .....	126
4.15.4	Inspection finale, mesurages et exigences .....	127
4.16	Variations rapides de température .....	127
4.16.1	Mesurage initial .....	127
4.16.2	Procédure d'essai .....	127
4.16.3	Inspection finale, mesurages et exigences .....	127
4.17	Vibrations .....	127
4.17.1	Mesurage initial .....	127
4.17.2	Procédure d'essai .....	127
4.17.3	Essai électrique (mesurage intermédiaire) .....	127
4.17.4	Inspection finale, mesurages et exigences.....	128
4.18	Secousses (chocs répétitifs).....	128
4.18.1	Mesurage initial .....	128

4.18.2	Procédure d'essai .....	128
4.18.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	128
4.19	Chocs .....	128
4.19.1	Mesurage initial .....	128
4.19.2	Procédure d'essai .....	128
4.19.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	128
4.20	Étanchéité des boîtiers.....	128
4.21	Séquence climatique .....	129
4.21.1	Généralités .....	129
4.21.2	Mesurages initiaux .....	129
4.21.3	Chaleur sèche.....	129
4.21.4	Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle.....	129
4.21.5	Froid.....	129
4.21.6	Basse pression atmosphérique .....	129
4.21.7	Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants .....	130
4.21.8	Mesurages finaux.....	130
4.22	Chaleur humide, essai continu.....	130
4.22.1	Mesurage initial .....	130
4.22.2	Procédure d'essai .....	130
4.22.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	131
4.23	Endurance .....	131
4.23.1	Mesurages initiaux .....	131
4.23.2	Procédure d'essai .....	131
4.23.3	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	131
4.23.4	Tension d'essai.....	131
4.23.5	Positionnement dans la chambre d'essai .....	132
4.23.6	Reprise .....	132
4.23.7	Inspection finale, mesurages et exigences.....	133
4.24	Variation de la capacité avec la température .....	133
4.24.1	Méthode statique .....	133
4.24.2	Méthode dynamique .....	134
4.24.3	Méthodes de calcul .....	134
4.25	Stockage.....	135
4.25.1	Stockage à haute température.....	135
4.25.2	Stockage à basse température .....	135
4.26	Surtension .....	136
4.26.1	Mesurage initial .....	136
4.26.2	Procédure d'essai .....	136
4.26.3	Inspection finale, mesurages et exigences.....	137
4.26.4	Informations devant être données dans la spécification particulière applicable .....	137
4.27	Essais de charge et de décharge et essai de courant d'appel.....	137
4.27.1	Mesurage initial .....	137
4.27.2	Procédure d'essai .....	138
4.27.3	Charge et décharge .....	138
4.27.4	Courant d'appel .....	139
4.27.5	Inspection finale, mesurages et exigences.....	139
4.28	Décharge de pression (pour les condensateurs électrolytiques en aluminium) ....	139
4.28.1	Généralités .....	139

4.28.2	Essai en courant alternatif.....	139
4.28.3	Essai en courant continu .....	139
4.28.4	Essai pneumatique.....	139
4.28.5	Inspection finale, mesurages et exigences.....	139
4.29	Caractéristiques à haute et basse températures.....	140
4.29.1	Procédure d'essai .....	140
4.29.2	Exigences .....	140
4.30	Essai de stabilité thermique.....	140
4.31	Résistance au solvant des composants.....	140
4.31.1	Mesurages initiaux .....	140
4.31.2	Procédure d'essai .....	140
4.31.3	Inspection finale, mesurages et exigences .....	141
4.32	Résistance au solvant du marquage .....	141
4.32.1	Procédure d'essai .....	141
4.32.2	Inspection finale, mesurages et exigences .....	141
4.33	Montage (pour les condensateurs pour montage en surface uniquement) .....	141
4.33.1	Substrat.....	141
4.33.2	Brassage à la vague .....	141
4.33.3	Brassage par fusion.....	142
4.34	Essai de cisaillement.....	144
4.34.1	Procédure d'essai .....	144
4.34.2	Inspection finale, mesurages et exigences .....	144
4.35	Essai de pliage du substrat .....	144
4.35.1	Procédure d'essai .....	144
4.35.2	Reprise .....	145
4.35.3	Inspection et exigences finales .....	145
4.36	Absorption diélectrique.....	145
4.36.1	Procédure d'essai .....	145
4.36.2	Exigences .....	146
4.37	Essai continu de chaleur humide accéléré .....	146
4.37.1	Mesurages initiaux .....	146
4.37.2	Méthodes d'essai .....	146
4.37.3	Procédures d'essai.....	146
4.37.4	Inspection finale, mesurages et exigences .....	146
4.38	Inflammabilité passive .....	146
4.38.1	Procédure d'essai .....	146
4.38.2	Inspection finale, mesurages et exigences .....	147
4.39	Essai aux surintensités.....	147
4.39.1	Mesurages initiaux .....	147
4.39.2	Procédure d'essai .....	147
4.39.3	Exigences pour le circuit de charge .....	148
4.39.4	Éléments non conformes .....	148
4.40	Surtension transitoire (pour condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte non solide) .....	148
4.40.1	Mesurage initial .....	148
4.40.2	Procédure d'essai .....	149
4.40.3	Inspection finale, mesurages et exigences .....	150
4.40.4	Conditions devant être indiquées dans la spécification applicable .....	150
4.41	Essai sur le développement des trichites .....	150

4.41.1	Généralités .....	150
4.41.2	Préparation des éprouvettes.....	151
4.41.3	Mesurage initial .....	151
4.41.4	Procédures d'essai.....	151
4.41.5	Sévérités des essais .....	151
4.41.6	Inspection finale, mesurages et exigences.....	151
Annexe A (informative)	Interprétation des plans d'échantillonnage et des procédures tels qu'ils sont décrits dans l'IEC 60410 et destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité .....	152
Annexe B (informative)	Règles pour la préparation des spécifications particulières pour des condensateurs et des résistances pour équipements électroniques, destinés à être utilisés dans les systèmes d'assurance de la qualité .....	153
B.1	Élaboration .....	153
B.2	Norme de référence .....	153
B.3	Diffusion .....	153
Annexe C (informative)	Disposition de la première page d'une spécification PCP/CQC .....	154
Annexe D (informative)	Exigences pour le rapport d'essai d'agrément de savoir-faire .....	155
D.1	Généralités .....	155
D.2	Exigences .....	155
D.3	Résumé des informations sur les essais (pour chaque CQC).....	155
D.4	Enregistrement de mesure.....	155
Annexe E (informative)	Guide pour l'essai en impulsion des condensateurs .....	156
E.1	Présentation .....	156
E.2	Conditions typiques en impulsions pour les condensateurs .....	156
E.3	Influence de l'inductance sur les essais en impulsions .....	157
Annexe F (informative)	Lignes directrices pour l'extension des essais d'endurance sur les condensateurs fixes .....	159
F.1	Présentation .....	159
F.2	Lignes directrices .....	159
Annexe G (normative)	Essai continu de chaleur humide avec application de tension, pour les condensateurs à film métallisé uniquement .....	160
G.1	Présentation .....	160
G.2	Procédure d'essai .....	160
Annexe H (normative)	Essai continu de chaleur humide accéléré, pour les condensateurs céramiques multicouches uniquement.....	161
H.1	Montage des condensateurs .....	161
H.2	Mesurage initial.....	161
H.3	Procédure d'essai .....	161
H.4	Reprise .....	161
H.5	Inspection finale, mesurages et exigences .....	161
Annexe Q (informative)	Procédures d'assurance de la qualité .....	162
Q.1	Généralités .....	162
Q.1.1	Domaine d'application de la présente annexe .....	162
Q.1.2	Définitions de l'assurance de la qualité .....	163
Q.1.3	Reprise .....	164
Q.1.4	Autres méthodes d'essai .....	164
Q.1.5	Rapports certifiés d'essais des lots acceptés .....	164
Q.1.6	Paramètres non vérifiés .....	164
Q.1.7	Livraison différée .....	165

Q.1.8	Réparation .....	165
Q.1.9	Registre des agréments .....	165
Q.1.10	Fabrication hors des limites géographiques .....	165
Q.2	Procédures d'homologation (QA) .....	165
Q.2.1	Aptitude à l'homologation .....	165
Q.2.2	Demande d'homologation .....	165
Q.2.3	Sous-traitance .....	165
Q.2.4	Procédure d'essai pour l'homologation initiale des produits .....	166
Q.2.5	Octroi de l'homologation .....	166
Q.2.6	Maintien de l'homologation .....	166
Q.2.7	Contrôle de conformité de la qualité .....	166
Q.3	Procédures d'agrément de savoir-faire .....	166
Q.3.1	Généralités .....	166
Q.3.2	Aptitude à l'agrément de savoir-faire .....	167
Q.3.3	Demande d'agrément de savoir-faire .....	167
Q.3.4	Sous-traitance .....	167
Q.3.5	Description du savoir-faire .....	167
Q.3.6	Démonstration et vérification de savoir-faire .....	167
Q.3.7	Octroi de l'agrément de savoir-faire .....	168
Q.3.8	Maintien de l'agrément de savoir-faire .....	168
Q.3.9	Contrôle de conformité de la qualité .....	168
Q.4	Procédure d'agrément de technologie .....	168
Q.4.1	Généralités .....	168
Q.4.2	Aptitude à l'agrément de technologie .....	169
Q.4.3	Demande d'agrément de technologie .....	169
Q.4.4	Sous-traitance .....	169
Q.4.5	Description de la technologie .....	169
Q.4.6	Démonstration et vérification de la technologie .....	169
Q.4.7	Octroi d'agrément de technologie .....	169
Q.4.8	Maintien d'agrément de technologie .....	169
Q.4.9	Contrôle de conformité de la qualité .....	169
Bibliographie .....	171	
Figure 1 – Puissance réactive en fonction de la fréquence .....	106	
Figure 2 – Relation entre la plage des températures de catégorie et la tension appliquée .....	107	
Figure 3 – Circuit d'essai de tension de tenue .....	114	
Figure 4 – Schéma de principe du circuit de mesure de l'impédance .....	119	
Figure 5 – Disposition de montage des condensateurs .....	121	
Figure 6 – Disposition de montage des condensateurs .....	121	
Figure 7 – Schéma typique d'un ondemètre-oscillateur à absorption .....	122	
Figure 8 – Schéma de principe du circuit de mesure .....	123	
Figure 9 – Circuit d'essai .....	124	
Figure 10 – Circuit d'essai pour les condensateurs électrolytiques .....	132	
Figure 11 – Circuit à relais .....	136	
Figure 12 – Circuit à thyristors .....	136	
Figure 13 – Forme d'onde de la tension aux bornes du condensateur .....	137	

Figure 14 – Forme d'onde de la tension et du courant.....	138
Figure 15 – Substrat approprié pour les essais mécaniques.....	143
Figure 16 – Substrat approprié pour les essais électriques .....	144
Figure 17 – Essai aux surintensités .....	148
Figure 18 – Circuit d'essai de la surtension transitoire .....	149
Figure 19 – Forme d'onde de la tension.....	150
Tableau 1 – Conditions d'arbitrage .....	110
Tableau 2 – Mesurage de la résistance d'isolation .....	111
Tableau 3 – Points de mesure.....	113
Tableau 4 – Force de traction.....	124
Tableau 5 – Couple.....	125
Tableau 6 – Nombre de cycles .....	130
Tableau 7 – Sévérités et exigences .....	147

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### **CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –**

#### **Partie 1: Spécification générique**

#### **AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60384-1 a été établie par le comité d'études 40 de l'IEC: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette cinquième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2008. Cette édition constitue une révision technique, incluant des révisions mineures des tableaux, des valeurs et des références.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- INTRODUCTION ajoutée;
- 4.41 Essai sur le développement des trichites ajouté;
- Annexe Q entièrement restructurée.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
40/2420/FDIS	40/2444/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60384, publiées sous le titre général *Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTRODUCTION

Le système de spécifications pour des condensateurs fixes utilisés dans des équipements électroniques est structuré dans un système hiérarchique constitué des types suivants de spécifications.

### Spécification générique

La spécification générique couvre tous les sujets, principalement les sujets communs à la famille de condensateurs fixes utilisés dans des équipements électroniques, tels que la terminologie, les méthodes de mesure et les essais. Lorsque des conditions ou des paramètres relatifs aux exigences spécifiques à la sous-famille particulière ou au type particulier de condensateur fixe sont exigés, de telles exigences doivent être données par une des spécifications subordonnées.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, la référence numérique de la spécification générique est l'IEC 60384-1.

### Spécification intermédiaire

Les spécifications intermédiaires couvrent tous les sujets s'ajoutant à ceux indiqués dans la spécification générique et qui sont spécifiques à un sous-groupe défini de condensateurs fixes. Ces sujets sont normalement les valeurs préférentielles des dimensions et des caractéristiques, les méthodes d'essai supplémentaires et les exigences applicables aux méthodes d'essai données dans la spécification générique, les exigences relatives à l'échantillonnage et à la préparation des éprouvettes, les sévérités d'essai recommandées et les critères d'acceptation préférentiels. La spécification intermédiaire présente également la structure et le domaine d'application des programmes d'essai qui doivent être appliqués dans toutes les spécifications particulières subordonnées.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications intermédiaires vont de l'IEC 60384-2 pour les condensateurs à film de polyester à actuellement l'IEC 60384-26 pour les condensateurs électrolytiques en aluminium à électrolyte solide en polymère conducteur. La variété de spécifications intermédiaires peut être adaptée aux différentes technologies de condensateurs fixes.

### Spécification particulière

Les spécifications particulières donnent, directement ou en faisant référence à d'autres spécifications, toutes les informations nécessaires pour décrire complètement un type et une plage donnés de condensateurs fixes, y compris les exigences relatives à toutes les valeurs des dimensions et des caractéristiques. Elles donnent également toutes les informations exigées pour l'assurance de la qualité du type et de la plage de condensateurs fixes couverts dans un système approprié d'assurance de la qualité, y compris les exigences relatives à toutes les sévérités d'essai et à tous les critères d'acceptation appliqués, et les programmes d'essai réalisés.

Les spécifications particulières peuvent être soit des spécifications du système IEC, soit une autre spécification liée à l'IEC, soit une spécification du fabricant ou de l'utilisateur. Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications particulières sont par exemple l'IEC 60384-3-101, pour une spécification particulière se rapportant à la spécification intermédiaire IEC 60384-3 et à la spécification particulière cadre auxiliaire IEC 60384-3-1.

### Spécification particulière cadre

Dans le système hiérarchique de spécifications, une spécification intermédiaire est complétée par une ou plusieurs spécifications particulières cadres utilisées pour assurer une

présentation uniforme des spécifications particulières. La spécification particulière cadre fournit au rédacteur des spécifications un modèle de disposition à adopter et un modèle d'informations à fournir, ainsi que des lignes directrices pour la préparation de spécifications particulières en respectant les exigences des spécifications génériques ou intermédiaires supérieures. Les spécifications particulières cadres ne sont pas considérées comme des spécifications applicables parce qu'elles ne décrivent pas de composants particuliers.

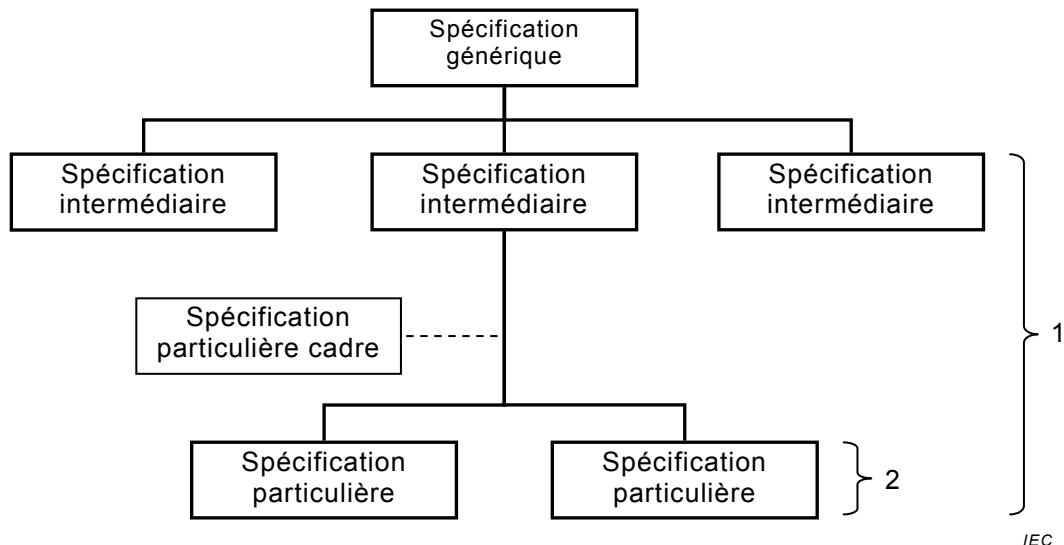
La présence d'un système de spécifications hiérarchiques établi, avec des spécifications particulières cadres, permet de préparer des spécifications particulières même en dehors du comité d'études de l'IEC concerné.

Pour le domaine d'application des condensateurs fixes, les références numériques aux spécifications particulières cadres sont par exemple l'IEC 60384-3-1, pour une spécification particulière cadre se rapportant à la spécification intermédiaire IEC 60384-3.

### **Spécification applicable**

Dans ce système, le terme «spécification applicable» porte sur des spécifications subordonnées contenant des exigences spécifiques, le cas échéant.

N'importe quelle spécification générique ou intermédiaire peut utiliser un résumé et des références universelles à des spécifications subordonnées de n'importe quel niveau hiérarchique en utilisant l'expression «spécification applicable».



### **Légende**

- 1 Indique la plage de "Spécifications applicables" pour la spécification générique supérieure, le cas échéant.
- 2 Indique la plage de "Spécifications applicables" pour la spécification intermédiaire supérieure, le cas échéant.

## CONDENSATEURS FIXES UTILISÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

### Partie 1: Spécification générique

## 1 Généralités

### 1.1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60384 est une spécification générique qui s'applique aux condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.

Elle établit des définitions, des procédures de contrôle et des méthodes d'essai normalisées à utiliser dans les spécifications intermédiaires et particulières des composants électroniques, pour les systèmes d'assurance de la qualité ou pour tout autre usage.

### 1.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

IEC 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Électrotechnique International*

IEC 60062, *Codes de marquage des résistances et des condensateurs*

IEC 60063, *Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs*

IEC 60068-1:2013, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 60068-2-1:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

IEC 60068-2-2:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche*

IEC 60068-2-6:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-13:1983, *Essais d'environnement – Partie 2-13: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60068-2-17:1994, *Essais d'environnement – Partie 2-17: Essais – Essai Q: Étanchéité*

IEC 60068-2-20:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-20: Essais – Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance à la chaleur de brassage des dispositifs à broches*

IEC 60068-2-21:2006, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage incorporés*

IEC 60068-2-27:2008, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-30:2005, *Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)*

IEC 60068-2-45:1980, *Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2-45: Essais – Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage*  
IEC 60068-2-45:1980/AMD1:1993

IEC 60068-2-54:2006, *Essais d'environnement – Partie 2-54: Essais – Essai Ta: Essai de la soudabilité des composants électroniques à l'aide de la méthode de la balance de mouillage*

IEC 60068-2-58:2015, *Essais d'environnement – Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)*

IEC 60068-2-67:1995, *Essais d'environnement – Partie 2-67: Essais – Essai Cy: Essai continu de chaleur humide, essai accéléré applicable en premier lieu aux composants*

IEC 60068-2-69:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-69: Essais – Essai Te: Essai de brasabilité des composants électroniques pour les composants de montage en surface (CMS) par la méthode de la balance de mouillage*

IEC 60068-2-78:2012, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

IEC 60068-2-82:2007, *Essais d'environnement – Partie 2-82: Essais – Essai XW1: Méthodes de vérification des trichites pour les composants électroniques et électriques*

IEC 60294, *Mesure des dimensions d'un composant cylindrique à sorties axiales*

IEC 60617, *Symboles graphiques pour schémas*

IEC 60695-11-5:2004, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60717, *Méthode pour la détermination de l'encombrement des condensateurs et résistances à sorties unilatérales*

IEC 61193-2, *Quality assessment systems – Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages* (disponible en anglais seulement)

IEC 61249-2-7:2002, *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale), plaquée cuivre*

ISO 3, *Nombres normaux – Séries de nombres normaux*

ISO 80000-1, *Grandeurs et unités – Partie 1: Généralités*